

BL8B2のARUPS II： 新装置の現状と有機ナノ物性に向けて

分子研 奥平幸司

有機分子薄膜

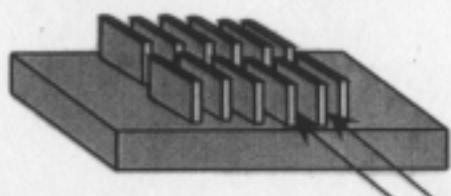
表面・界面の電子構造

分子配向の違い

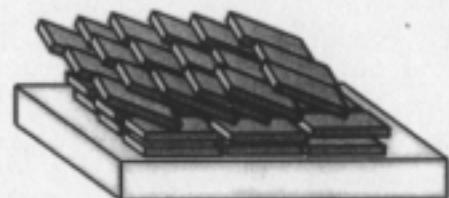
有機分子素子



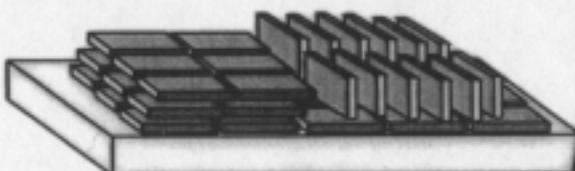
基板-分子間相互作用



分子間相互作用

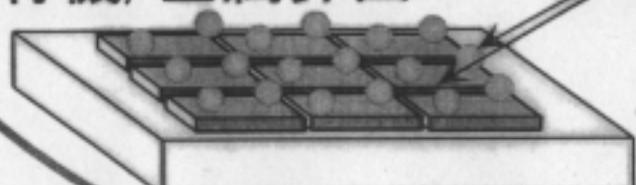


ナノメートル程度の成長で
(1) 配向が変わる。

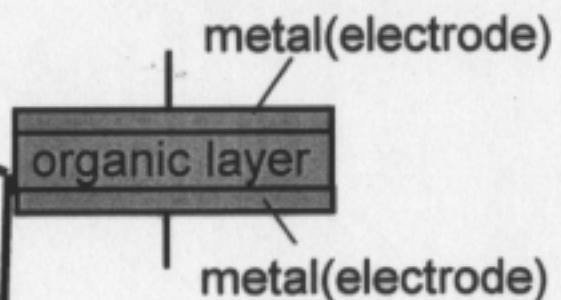
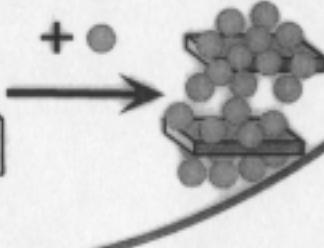


(2) 異なる配向が現れる

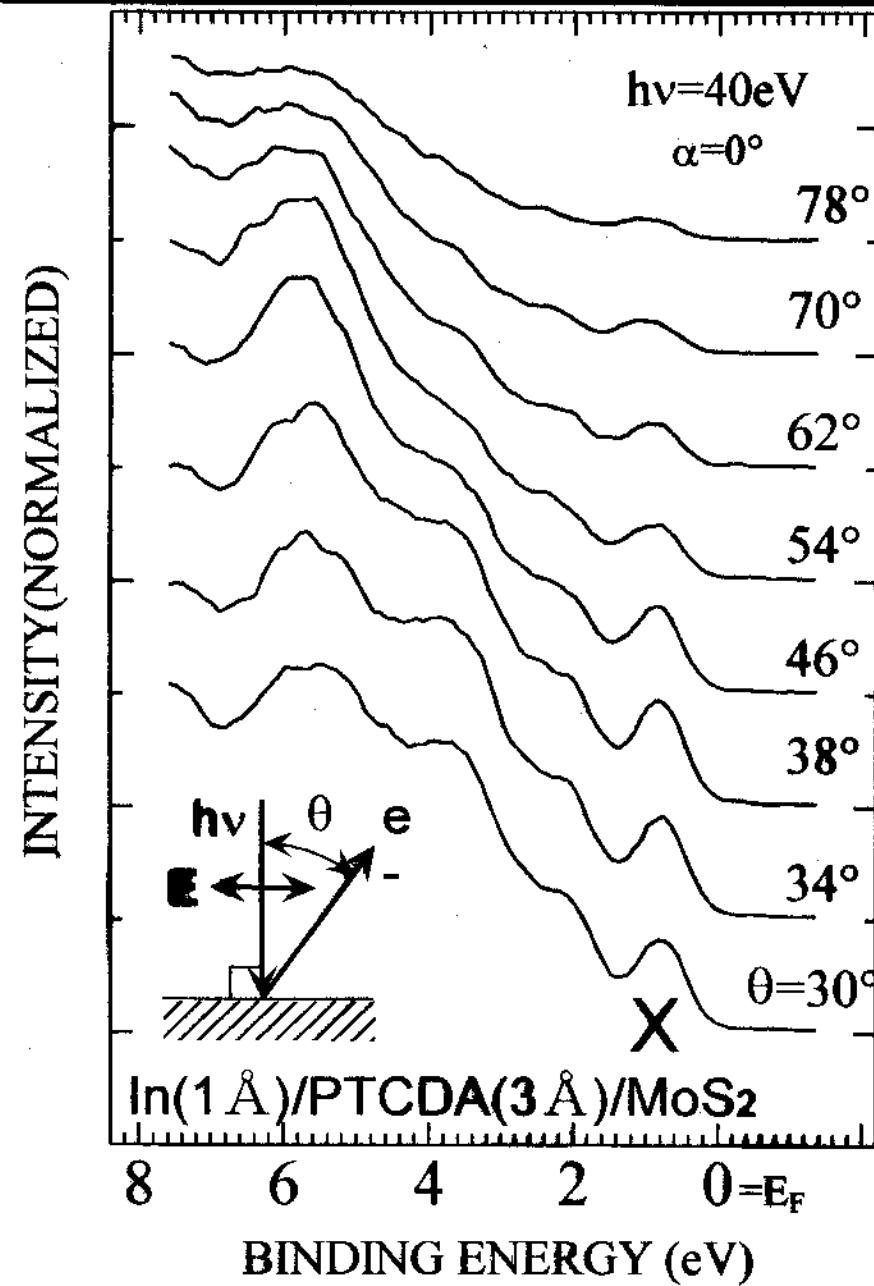
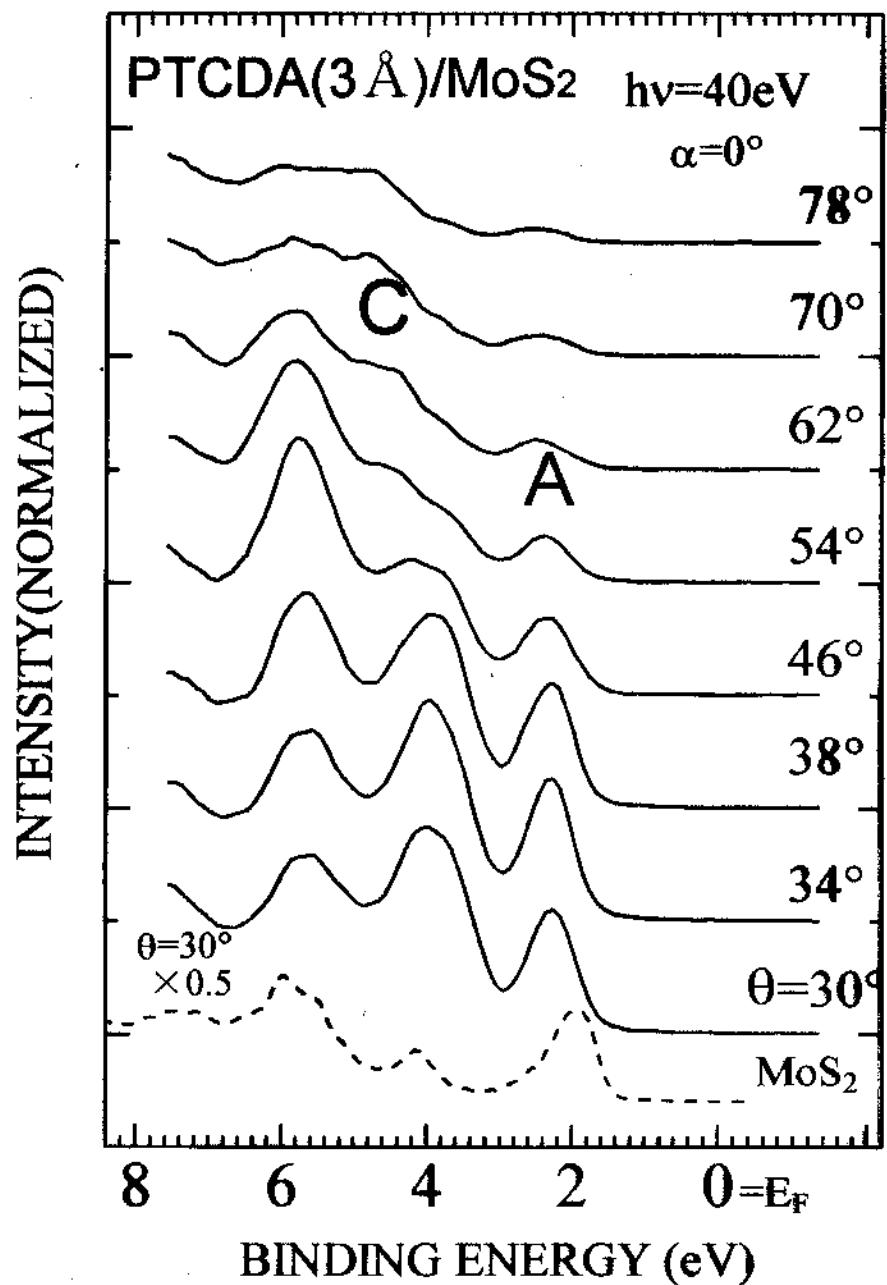
有機/金属界面



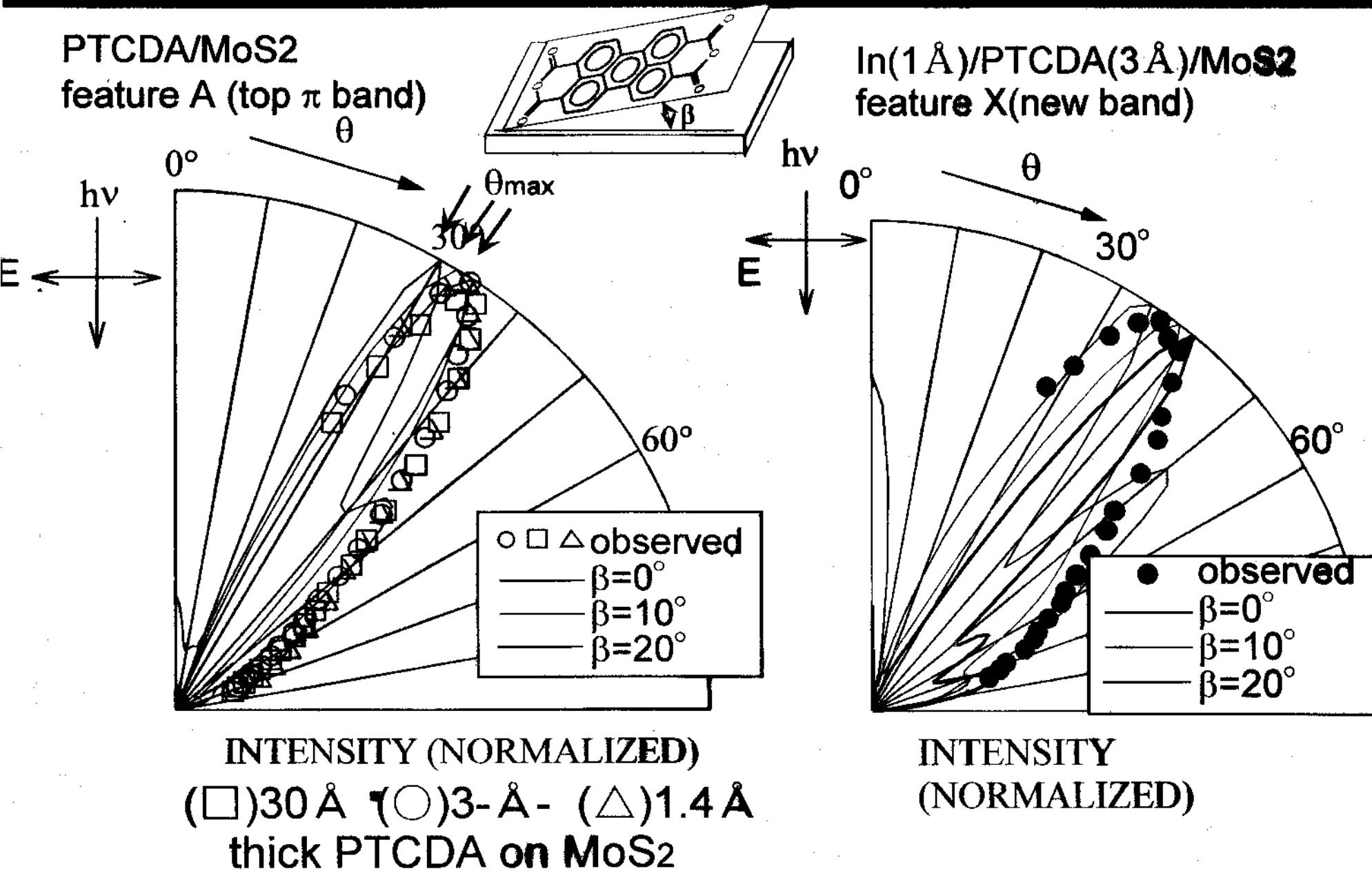
金属-分子間相互作用



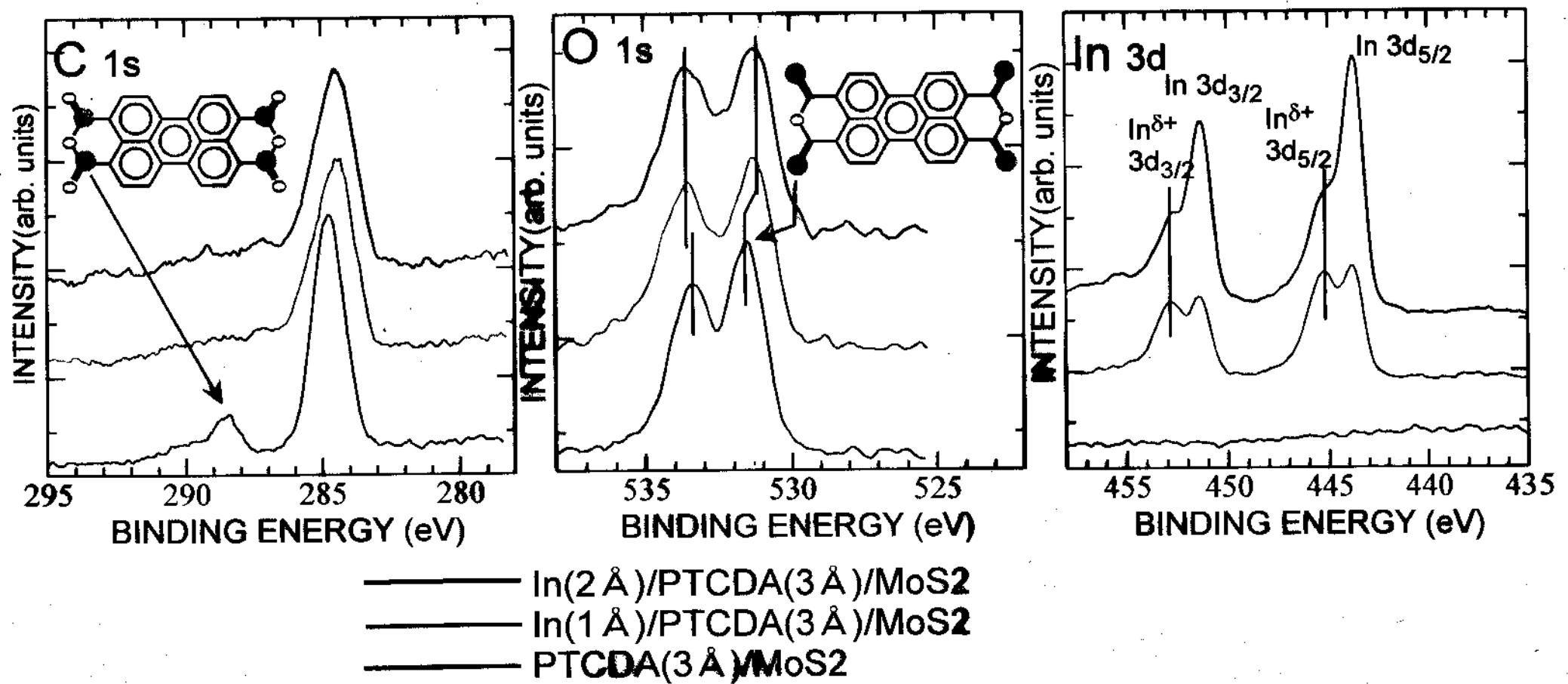
Take-off angle (θ) dependence of ARUPS of PTCDA/MoS₂ and In/PTCDA/MoS₂



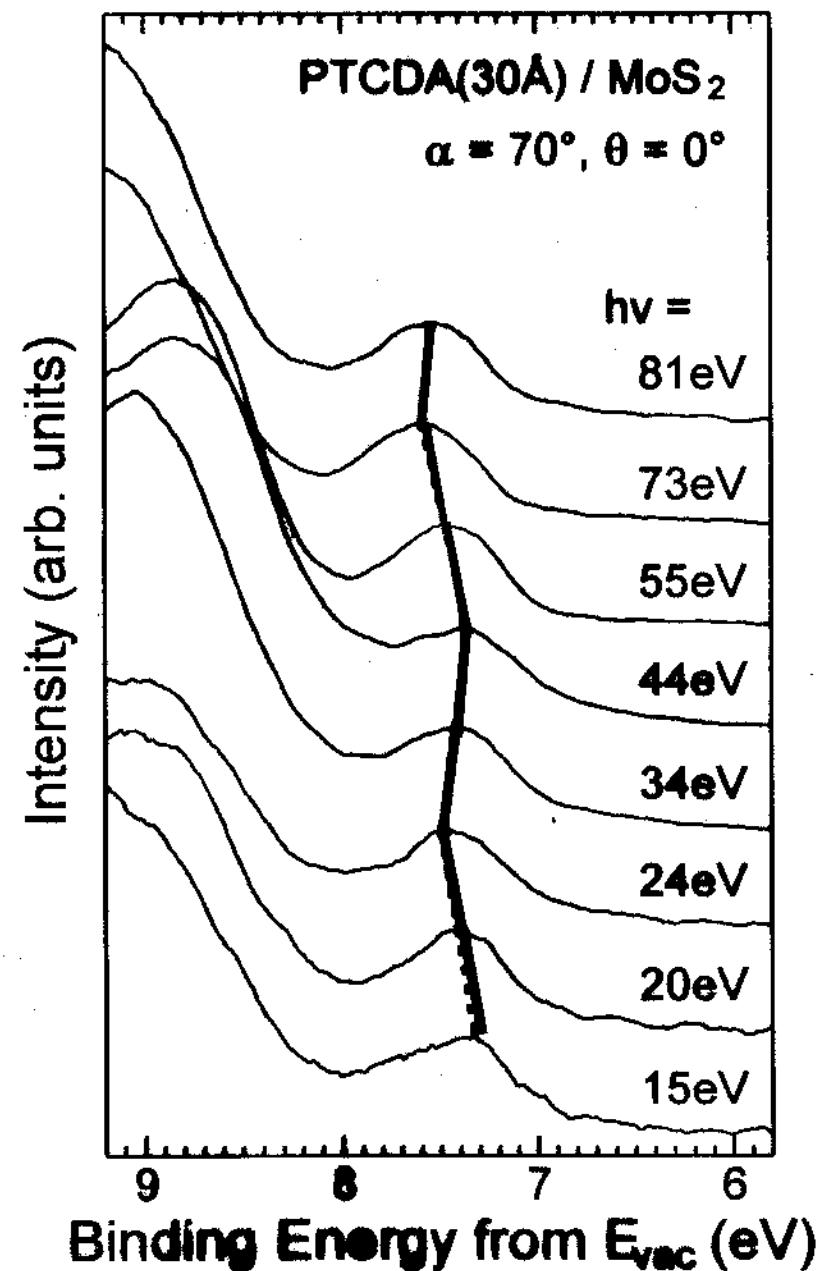
Comparison between observed and calculated θ dependences of photoelectron intensity



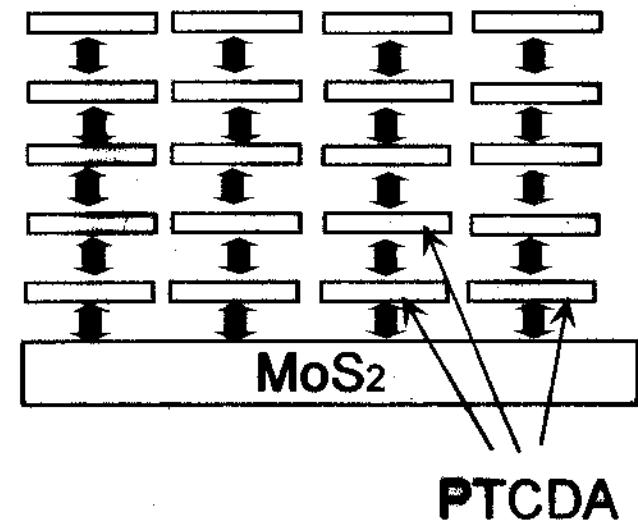
C1s, O1s, and In 3d XPS spectra of PTCDA PTCDA/MoS₂, and In/PTCDA/MoS₂



$h\nu$ dependence of ARUPS of PTCDA(30 Å) / MoS₂



PTCDA分子間相互作用
(分子面垂直方向)



CuPc on HOPG

CuPc on HOPG system の分子配向と電子状態をHR-ARUPSから求めた。

高分解能



共存する異なる分子配向を分離

振動準位

トータルの分解能を上げる(分光器+アナライザー
ARUPS10に変更済み)

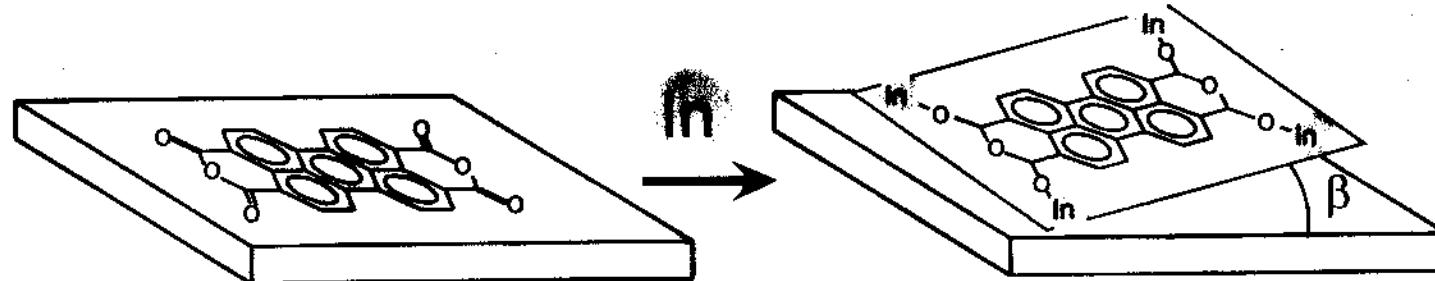
低温測定 (現在計画進行中)

まとめ

In/PTCDA/MoS₂(有機金属界面)

In-PTCDA system の分子配向と電子状態を
ARUPS, LEED, XPS) から求めた.

In原子は PTCDAのC=Oと相互作用している



PTCDA/MoS₂

PTCDA分子間相互作用(分子面垂直方向)

- 高分解測定(分光器+アナライザー)
- Valence領域(UPS)とCore領域(XPS)を測定できるシステム

